

Nanoanalytics Workshop

Dienstag, 16. Mai 2023

Session II:: Atomic Force Microscope (AFM) - 100.004 (14:10 - 14:20)

-Vorsitzende der Sitzung: Riya Gupta

Session II:: Scanning Near-Field Optical Microscope (SNOM) - 100.004 (14:20 - 14:35)

-Vorsitzende der Sitzung: Christian Guthel

Session II:: Transmission Electron Microscope (TEM) - 100.004 (14:35 - 14:50)

-Vorsitzende der Sitzung: Harald Rösner

Session II:: Time-of-Flight- Secondary Ion Mass Spectroscopy (TOF-SIMS) - 100.004 (14:50 - 15:10)

-Vorsitzende der Sitzung: Bonnie June Tyler